

MĚŘENÍ DRSNOSTI A ROZPTYLOVÝCH VLASTNOSTÍ OPTICKÝCH POVRCHŮ

CASI SCHMITT INDUSTRIES, INC.

Systém CASI (Complete Angle Scatter Instrument) představuje zařízení pro měření a vyhodnocování pole rozptýleného světla. Jde o přístroj typu ARS od výrobce Schmitt Measurement Systems, který měří parametry rozptýleného záření na vlnových délkách 325 nm nebo 633 nm. Na tomto špičkovém rozptyloměru nabízíme měření drsnosti a rozptylových parametrů optických i strojních povrchů.

VÝSTUPNÍ INFORMACE

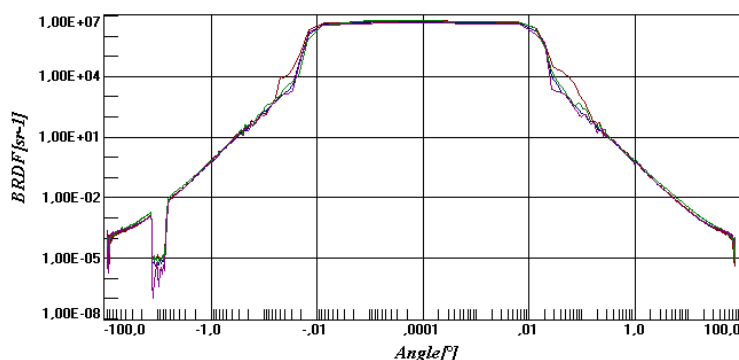
- > drsnost optických i strojních ploch
- > znečištění materiálů
- > defektů a pravidelných struktur
- > parametry kompletního rozptýleného pole záření od materiálů

TYPY VZORKŮ

- > precizně opracované optické povrchy
- > veškeré difuzní materiály
- > polovodičové destičky
- > mechanické součástky

PARAMETRY PŘÍSTROJE

- > nejmenší měřitelná střední kvadratická hodnota RMS (Rq) drsnosti povrchu je <math><1\text{ nm}</math>
- > zařízení měří všechny důležité parametry rozptýleného záření na vlnových délkách 325 nm a 633 nm
- > rozptýlené pole světla od materiálu měří jak v průchozím poli, tak i v odraženém poli v intervalu -90°–90° od normály povrchu



Naměřené pole rozptýleného záření (prostorová rozptylová funkce BRDF) od precizně vyleštěných optických ploch.

DALŠÍ INFORMACE NA VYŽÁDÁNÍ



REGIONÁLNÍ CENTRUM
POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ
A MATERIÁLŮ

WWW.RCPTM.COM RCPTM.SERVICES@UPOL.CZ



Univerzita Palackého
v Olomouci